

Ci7800

Ci7600

повторяемость (белая плитка)	0,01 эфф. ΔECIELAB*	0,03 эфф. ΔECIELab
согласованность между приборами**	0,08 средн. ΔECIELAB*	0,15 средн. ΔECIELab*
освещение	Импульсная ксеноновая лампа, калибровка по D65	Импульсная ксеноновая лампа, калибровка по D65
фильтр(ы) Уф:	400 нм (стандартно), 420 нм***, 460 нм***	400 нм (стандартно), 420 нм***, 460 нм***
спектральный диапазон	360 до 780 нм	360 до 750 нм
интервал длин волн	10 нм (по умолчанию); 5 нм; 20 нм	10 нм (по умолчанию); 20 нм
фотометрический диапазон	0,0% до 200% по отражению	0,0% до 200% по отражению
фотометрическое разрешение	0,001%	0,01%
время цикла измерения	≈2,5 секунд	≈2,5 секунд
отражательные апертуры	25 мм	25 мм
	17 мм	17 мм***
	10 мм	10 мм
	6 мм	6 мм
	3,5 мм***	3,5 мм***
всего апертур пропускания	22 мм	22 мм
	17 мм	10 мм
	10 мм	6 мм
	6 мм	
прямое пропускание	22 мм	22 мм
оптическая конфигурация	Тридиффузных луча 8°, сфера 6 дюймов, матрица ПЗС/голографическая диф. решетка	Тридиффузных луча 8°, сфера 6 дюймов, матрица ПЗС/голографическая диф. решетка
размеры	Высота 31 см (12,2 дюйма)	Высота 31 см (12,2 дюйма)
	Ширина 22 см (8,7 дюйма)	Ширина 22 см (8,7 дюйма)
	Глубина 56 см (22,0 дюйма)	Глубина 56 см (22,0 дюйма)
масса	20,5 кг (45,0 фунт)	20,5 кг (45,0 фунт)
температура (при работе)	от 5 до 40 °C	от 5 до 40 °C
относительная влажность (при работе)	от 5% до 85%, без конденсации	от 5% до 85%, без конденсации
требования к электропитанию	100 до 240 В / 50 до 60 Гц	100 до 240 В / 50 до 60 Гц
интерфейс	USB 2.0	USB 2.0
NetProfiler	Встроенный	Встроенный
специальные функции:	Лазерный прицел для точного позиционирования образцов	Лазерный прицел для точного позиционирования образцов
	Одновременный SPIN/SPEX Датчики температуры и влажности в приборе Автоматическое управление фильтрами УФ и объективом	Одновременный SPIN/SPEX Датчики температуры и влажности в приборе Автоматическое управление фильтрами УФ и объективом
	Вертикальная или горизонтальная*** ориентация плоскости измерения	Вертикальная или горизонтальная*** ориентация плоскости измерения

- *Режим высокой прецизионности; ** Среднее ΔE для керамических стандартов BCRA относительно стандартных значений X-Rite в лабораторных условиях, 25 мм, 22 °C; *** По заказу.
- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения.

